

lewandowski

ARKADIUSZ LEWANDOWSKI

Arkadiusz Lewandowski urodził się w 1975 roku w Warszawie. W 1994 roku ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego w klasie o profilu matematyczno-fizycznym i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych. W latach 1996–1997 studiował na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w latach 1998–1999 przebywał na stypendium Sokrates/Erasmus w Universität Gesamthochschule Kassel, Kassel, Niemcy. W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych z oceną celującą, otrzymując dyplom magistra inżyniera za pracę *Generator sygnału sinusoidalnego 24 GHz*, napisaną pod kierownictwem Wojciecha Wiatra. W 2010 roku obronił (z wyróżnieniem) rozprawę doktorską *Multi-frequency Approach to Vector-network-analyzer Scattering-parameter Measurements*, napisaną pod kierownictwem profesora Janusza Dobrowolskiego.

W latach 2002–2004 Arkadiusz Lewandowski pracował na stanowisku asystenta w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, gdzie zajmował się cyfrową generacją sygnałów radiolokacyjnych. W latach 2004–2009 przebywał na stażu naukowym w National Institute of Standards and Technology w Boulder, USA, gdzie był zaangażowany w rozwój me-



tod kalibracji i analizy niepewności w pomiarach wektorowym analizatorem obwodów. Od 2010 roku pracuje w Instytucie Systemów Elektronicznych na stanowisku adiunkta.

Arkadiusz Lewandowski jest autorem lub współautorem trzech publikacji w czasopiśmie „IEEE MTT” oraz autorem ponad 15 referatów prezentowanych na konferencjach MIKON, ARFTG i EuMC. W 2008 roku był laureatem nagrody za najlepszy artykuł dotyczący modelowania na konferencji MIKON 2008. W 2005 roku był laureatem stypendium MTT-S. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół miernictwa mikrofalowego, a w szczególności wykorzystania metod statystycznych w kalibracji wektorowych analizatorów obwodów.

Zainteresowania pozazawodowe obejmują m.in. filozofię, biegi przełajowe i turystykę górską.

Słowa kluczowe

- mikrofałe
- metrologia
- parametry rozproszenia
- wektorowy analizator obwodów